

別表

設計製造等の機器使用基本利用料金表

設置場所	用途	装置番号と装置名	仕様	型番	メーカー	学内料金	備考
1F 104	分子量測定	1	高分解能質量分析装置(MS)	二重収束質量分析計	JMS-SX102A	日本電子	324円/時間
		2	飛行時間型質量分析装置(TOF-MS)	飛行時間形質量分析計	JMS-T100LP	日本電子	520円/時間
	有機物構造解析	3	核磁気共鳴装置 I (500MNMR)	超伝導磁石 (500MHz)	AVANCEIIIHD 500	ブルカー	380円/時間
		5	核磁気共鳴装置 II (400MNMR)	超伝導磁石 (400MHz)	AVANCE400S	ブルカー	368円/時間
1F 106	微細構造解析	7	多目的透過電子顕微鏡(TEM)	電界放射型200kV透過型電子顕微鏡	JEM-F200	日本電子	1,584円/時間
1F 107	微細ビーム加工	8	集束イオンビーム装置(FIB)	Ga+イオンビーム発生	FB-2000A	日立	916円/時間
2F 204	X線構造解析	9	全自動水平型多目的X線回折装置(XRD)	高精度試料水平型	SmartLab	リガク	1,004円/時間
1F 105	結晶方位解析	10	結晶方位測定解析装置(EBSD)	後方散乱電子線解析パターン法	JSM-7000F	日本電子	388円/時間
	三次元表面 微細構造解析	11	3次元走査型電子顕微鏡(3D-SEM)	立体的凹凸観察	ERA-8800	エリオニクス	508円/時間
	表面微細構造解析	12	電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	数十万倍拡大した試料表面形状観測	JSM-6701F	日本電子	520円/時間
2F 203	極表面元素分析	13	X線光電子分光分析装置(XPS)	極表面層の元素・状態分析	KRATOS AXIS-NOVA	島津	856円/時間
2F 204	表面元素分析	15	電界放出型電子線マイクロアナライザ(EPMA)	FE 電子銃搭載 波長分散形 X線分光器 4 基搭載	JXA-8530F	日本電子	1,028円/時間
2F 209	硬さ測定	16	超微小押し込み硬さ試験機	超微小領域測定	ENT-1100a	エリオニクス	316円/時間
2F 204	元素濃度分析	18	蛍光 X 線分析装置(XRF)	BからUまで検出 FP法による定量分析	XRF1700WS	島津	556円/時間

2F 208	有機元素濃度分析	19	有機元素分析装置(CHN)	物質構成元素(C, H, N)の組成定量	MT-5	ヤナコ	492円/時間	
2F 204	微小部元素濃度分析	23	X線分析顕微鏡	微小領域分析できる顕微鏡タイプ	XGT-5000Type II	堀場製作所	612円/時間	
2F 206	物理的・化学的 状態変化解析	24	示差熱天秤・示差走査熱量計TG・DTA・DSC(熱分析)	プログラムで変化する温度に依存する状態変化計測	TG 8120 DSC 8270	リガク	204円/時間	
2F 202	金属溶解	25	卓上型高周波溶解炉	小型の高周波溶解炉	MU-1700D	美和製作所	108円/時間	
2F 205	真空加熱	26	高温型赤外線真空炉	真空・各種ガス雰囲気高温アニール	IVF298W	サーモ理工	216円/時間	
1F-108	表面観察	27	デジタルマイクロスコープ	高精細デジタルスコープ	VHX-900	キーエンス	252円/時間	
飯塚	固体・生体内の細胞観察	30	落射型蛍光顕微鏡	励起蛍光種の観察励起波長:385nm、475nm、555nm、630nmの4波長	LSM510	カールツァイス	200円/時間	
	光学活性物質の 立体構造解析	31	円二色性分散計	180~600 nmの紫外・可視領域の円偏光スペクトル測定	J-500A	日本分光	200円/時間	
	蛍光測定	32	フーリエ変換型 蛍光分光光度計	励起側:220~750nm、蛍光側:220~750nmの範囲で分析	FP-6500	日本分光	200円/時間	
	基解析	33	フーリエ変換赤外吸収装置(FT-IR)	測定波数領域:7800~350cm ⁻¹ 、分解能:0.5cm ⁻¹ 、S/N比42000:1の感度で赤外スペクトル測定	FT/IR-615	日本分光	200円/時間	
2F-204	炭素蒸着	34	カーボンコーター①	専用直結型ロータリーポンプ 135 L/min	EC-32010型	日本電子	500円/時間	
1F-105	炭素蒸着	35	カーボンコーター②	ステージ回転式、TMP:67L/s	SVC-700-2型	日本電子	500円/時間	
	金属蒸着	36	オートファインコーター	マグネトロン形スパッタリング方式	JFC-1600型	日本電子	500円/時間	

1F-107	表面研磨	37	イオンミリング	印加電圧:1~6kV、放電ガス:アルゴン	E-3200	日立	500円/時間	
1F-108	微小物操縦	38	クイックプロ	X軸:20mm Y軸:20mm Z軸:30mm	QP-3RH 右手セット	ニコンインステック	300円/時間	
7号棟 1F-117	イオンダイナミクス解析	39	広帯域固体NMR	(5~800MHz)広帯域で、温度1.5K~200K、磁場は8Tまでの範囲で測定	PROT3000MR	サムウェイ	300円/時間	
	電子状態評価	40	電子スピン共鳴装置(ESR)	室温、液体窒素温度、液体ヘリウム温度域で測定可能	JES-RE2X	日本電子	300円/時間	
2F 205	高融点金属溶解	41	アークメルト溶解炉	鉄換算で10~20gのボタン状試料の溶解可能	NEV-AD	日新技研	300円/時間	
	熱電特性評価	43	熱電特性評価装置 ZEM-1	室温~1000°C近傍までゼーベック係数と4端子法による電気抵抗測定が可能	ZEM-1	真空理工	104円/時間	
	粉碎機	44	遊星ボールミル	最大4個の容器をセット可能	モデルP5	フリッチュ	96円/時間	
岩田研	機械強度測定	45	小型卓上万能試験機	引張・曲げ・圧縮・せん断・サイクル試験が可能	AGS-H/EZTest-50N	島津	200円/時間	
2F 206	微小部観察	46	光学顕微鏡	50倍~400倍の光学顕微鏡観察	L150-TT-DIC-A	ニコン	108円/時間	
2F-204	熱画像	49	高機能型熱画像計測装置	温度分解能(°C)0.04、画素数640×480	CPA-SC620 CCX-9	テノー	200円/時間	
2F 206	試料埋込機	50	ハンドプレス	加圧加熱用樹脂用 Φ25 150°C加熱	P-4210型	Wingo	200円/時間	
2F 206	研磨機	51	小型平面研磨機	200Dmmの研磨盤、研磨回転数20~400r/min	ML-110NT	MARUTO	200円/時間	
2F 206	研磨機	52	ダイアラップ研磨機	150Dmmの研磨盤、研磨回転数30~190r/min	ML-150P	MARUTO	200円/時間	
2F 208	微量計量	53	ザルトリウスウルトラマイクロ天秤	最小表示 0.1µg	SE2	ザルトリウス・ジャパン	200円/時間	

※装置利用料金は15分単位で切り上げ課金

・使用可能時間は9:00~17:00とする。

・他教育機関の利用は学内料金

操作指導料・代理操作料金		学内
操作指導料		3,000円/時間
代理操作		5,000円/時間

消耗品料金		
品名	単位	単価
TEM用グリッド コロジオン支持膜 STEM150Cuグリッド、カーボン補強済 (グリッドピッチ 150 μ m)	1枚	¥360
スパッターターゲット Pt	30秒 (0.5分)	¥730
液体窒素	1kg	¥190
カーボン棒① JEOL EC-32010型用	1本	¥2,060
カーボン棒② JEOL SVC-700-2型用	1本	¥2,040